



۱۳۰۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی برق

قطب علمی اندازه‌گیری و مشخصه‌یابی

افزارهای زیرسیستم‌های الکترومغناطیسی

# استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری دوپالسی برای تقویت شدت تابش پلاسمای ظهور خطوط طیفی جدید

علی صفائی<sup>\*</sup>، مریم بحرینی، سید حسن توسلی

پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[A\\_Safi@sbu.ac.ir](mailto:A_Safi@sbu.ac.ir): \*رایانame نویسنده مسئول

## -۱ مقدمه

در روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری با متتمرکز شدن پالس لیزر بر مساحت بسیار کوچکی از سطح نمونه (در حدود چند میکرومتر) انرژی بالایی در واحد سطح به نمونه رسیده و حجم کوچکی از ماده کنده شده و تبخیر می‌شود و باعث تشکیل پلاسمایی می‌شود. نور گسیلی از پلاسما اطلاعاتی کمی و کیفی در ارتباط با عناصر داخل نمونه به ما می‌دهد [۱]. اگرچه روش LIBS مزایای متعددی را دارا می‌باشد اما معایبی نیز دارد که باید اذعان کرد. تحقیقات و مطالعات بنیادینی برای بهبود حساسیت، افزایش LIBS دقت، کاهش اثر ماتریس و به طور کلی معایب انجام شده است [۲].

چکیده: در این مقاله دو مزیت اساسی روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری<sup>۱</sup> دوپالسی که شامل افزایش و تقویت شدت خطوط طیفی تابش پلاسمای ظهور خطوط طیفی جدید می‌باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. هم چنین تاثیر فاصله زمانی دوپالس لیزر بر شدت تابش پلاسما مورد بررسی قرار گرفته و فاصله زمانی بین دوپالس لیزر برای مشاهده بیش ترین مقدار افزایش شدت تابش پلاسمای تعیین شده است. پیکربندی دوپالسی که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است پیکربندی متعامد پیش کنندگی و نمونه مورد آزمایش آلیاژ استاندارد آلومینیوم (Al-4043) می‌باشد.

کلیدواژه: طیف سنجی فروشکست القایی لیزری دوپالسی، آلومینیوم، پیکربندی متعامد، پیش کنندگی

<sup>۱</sup> LIBS

۴۶۲